

SFT110

COATING THICKNESS ANALYSER



Das **SFT110** ist ein Röntgenfluoreszenz-Spektrometer zur Messung von Schichtdicke und Zusammensetzung metallischer Überzüge auf kleinsten Proben. Dank optimierter Geometrie des **SFT110** ist es möglich, Messungen von dünnen Schichten an kleinen Flächen in kurzer Zeit mit hoher Präzision durchzuführen. Schichtdicken-Messaufgaben von dekorativen metallischen Schichten und funktionalen, galvanischen Beschichtungen an Steckverbindern, Leiterplatten, Teilen aus der Elektro- und Automobilindustrie, sowie die Bestimmung der Zusammensetzung von Legierungsschichten gehören zu den Standardmessaufgaben des **SFT110**.

Die Analyse von galvanischen Bädern auf ihren Metallionengehalt gehört zum Standardmessprogramm des **SFT110**.

SFT110 is an X-ray fluorescence spectrometer for the analysis of thin coatings for thickness and composition on small samples. Using advanced x-ray micro focus geometry, **SFT110** Series is capable of measuring thin film applications in short measurement time. The measurement of the coating thickness and composition of layers, such as decorative metallic coatings or functional electro plated coatings on connectors, printed circuit boards or parts from electro- and automotive industry are standard with **SFT110**.

The analysis of plating baths solution can easily be done with **SFT110**.



Seiko Instruments GmbH

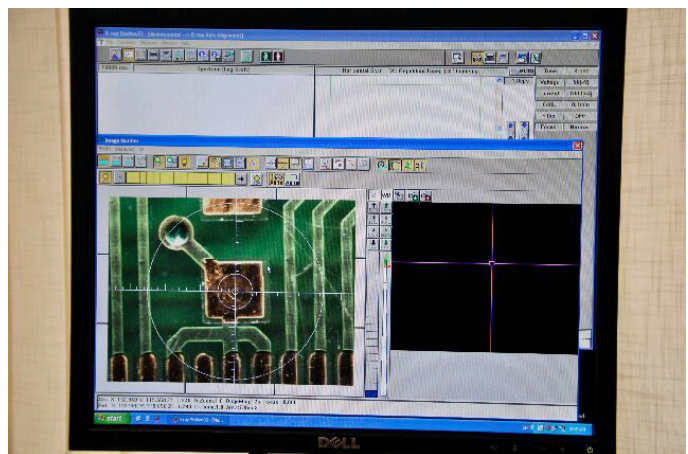
Nano Technology
 Siemensstraße 9
 63263 Neu-Isenburg
 Germany
 Telephone: 49-6102-297-0
 Facsimile: 49-6102-297-320

info@seiko-instruments.de
<http://www.SIINT.EU>

*Technische Änderungen vorbehalten
 Specifications subject to change without notice.*

Technische Daten / Technical data:

Hardware	SFT110	Software	SFT110
Elements measured	Ti - Bi	Thin film FP standardless (max 5 layers, 10 elements)	X
Sample type	Solid, liquid, coatings	Thin film calibration	X
Xray source	Small air-cooled tube (W)	Spectrum comparison	X
Voltage / current	50kV / 1 mA	KLM markers	X
Detector	Proportional counter	Bulk FP	X
Collimator sizes	0.1 mm circular 0.2 mm circular option: 0.05 mm circular 0.025x0.4mm	Bulk Calibration (liquids)	X
Secondary filter (optional)	Co filter, motorized	MS-Excel	X
Primary filter	Al filter, open position	MS-Word	X
Max. sample dimensions (WxDxH)	Standard type: 500 × 400 × 150 mm	Multi point measurement	X
Max. sample weight	10 kg	Spectrum matching	X
Stage travel (XxYxZ)	250 × 200 × 150 mm	Image processing	X
Required space (WxDxH) without PC	600 × 810 × 675 mm	Optical picture of the whole sample stage	with wide view option
Weight	120 kg	Auto focus system (laser beam)	option
Dual colour camera system (wide view)	option	Automatic positioning (auto-auto focus)	option
Sample collision prevention mechanism	X		
Slotted sample chamber	option		



Seiko Instruments GmbH
 Nano Technology
 Siemensstraße 9
 63263 Neu-Isenburg
 Germany
 Telephone: 49-6102-297-0
 Facsimile: 49-6102-297-320

info@seiko-instruments.de
<http://www.SIINT.EU>

*Technische Änderungen vorbehalten
 Specifications subject to change without notice.*

SFT110 / 04.11